# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-005309

(43) Date of publication of application: 10.01.1995

(51)Int.CI.

G02B 5/08

(21)Application number : 06-091007

(71)Applicant : BOC GROUP INC:THE

(22) Date of filing:

28.04.1994

(72)Inventor: WOLFE JESSE D

**VOSSEN JOHN L** 

(30)Priority

Priority number: 93 54540

Priority date : 28.04.1993

Priority country: US

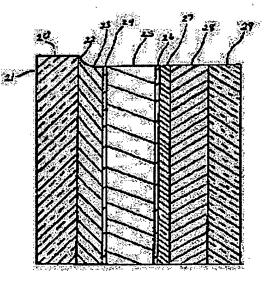
# (54) DURABLE FIRST SURFACE MIRROR AND SECOND SURFACE MIRROR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a durable mirror against chemical

attacks.

CONSTITUTION: A first surface mirror has an aluminum substrate 20, and on the aluminum substrate 20, a thin film consisting of seven layers, that is, titanium, nickelchromium alloy, silver, Ni-CrNx, silicon nitride, silicon dioxide and titanium dioxide layers 23-29 is vacuumdeposited. And in the example of a second surface mirror, the mirror has a glass substrate, and on the glass substrate, a thin film consisting of five layers, that is, silicon dioxide, Ni-CrNx, silver, Ni-CrNx, and silicon nitride is vacuum-deposited. Furthermore, in order to give protection, on the second surface mirror, a protective film consisting of a laminate or the other protective coating may be formed.



[Date of request for examination]

28.04.1994

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2831932

[Date of registration]

25.09.1998

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

DURABLE FIRST-SIDE MIRROR AND SECOND-SIDE MIRROR

PUB. NO.:

07-005309 [ JP 7005309

PUBLISHED:

January 10, 1995 (19950110)

INVENTOR(s):

JIESHII DEII UORUFU

JIYON ERU BUOTSUSEN

APPLICANT(s): BOC GROUP INC THE [196335] (A Non-Japanese Company or

Corporation), US (United States of America)

APPL. NO.:

06-091007 [JP 9491007] April 28, 1994 (19940428)

FILED:

PRIORITY:

7-54,540 [US 54540-1993], US (United States of America),

The state of

April 28, 1993 (19930428)

INTL CLASS:

[6] G02B-005/08

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

18408859

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 7005309 U2 19950127 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Kind Date Applic No Kin U2 19950127 JP 93U38273 Kind Date Patent No

U 19930619 (BASIC) JP 7005309

Priority Data (No, Kind, Date): JP 93U38273 U 19930619

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 7005309 U2 19950127 Priority (No, Kind, Date): JP 93U38273 U 19930619 Applic (No, Kind, Date): JP 93U38273 U 19930619 IPC: \* A01C-001/00

Language of Document: Japanese

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

ANT THE PROPERTY OF

# 特開平7-5309

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別配号 庁内整理番号

FI ·

技術表示箇所

G 0 2 B 5/08

A 9224-2K

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平6-91007

(22)出願日 平成6年(1994)4月28日

(31)優先権主張番号 08/054540

(32)優先日 1993年4月28日

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出願人 591021833

ザ ピーオーシー グループ インコーポ

レイテッド

アメリカ合衆国 ニュージャージー州

· 07974ニュー プロヴィデンス マーリー to

ヒル マウンテン アベニュー 575

(72)発明者 ジェシー ディー ウォルフ

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

94583 サン ラモーン パイン ヴァリ

ー ロード 3003

(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外7名)

最終頁に続く

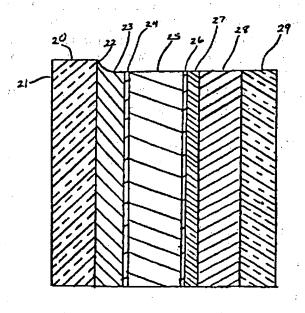
(54) 【発明の名称】 耐久第1面ミラーおよび第2面ミラー

#### (57)【要約】

.

【目的】 本発明の目的は、化学的攻撃に耐え得る耐久。 性のあるミラーを提供することにある。

【構成】 本発明の一実施例では、第1面ミラーがアル ミニウム基板20を有し、該アルミニウム基板20上 に、7つの層すなわち、チタン、ニッケルークロム合 金、銀、Ni-CrNx、窒化ケイ素、二酸化ケイ素及 び二酸化チタンの層からなる薄膜が蒸着されている。ま た、第2面ミラーの実施例では、ミラーがガラス基板4 0を有し、該ガラス基板40上に、5つの層すなわち、 二酸化ケイ素、Ni-CrNr、銀、Ni-CrNr及/ び窒化ケイ素の層からなる薄膜が蒸着されている。更に 保護を与えるため、第2面ミラー上に、積層(ラミネー) ト) 又は他の保護コーティングからなる保護膜を設ける こともできる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板、第1金属下塗層、反射金属層、第2金属下塗層および保護層の順序で構成された第1または第2面ミラーにおいて、

第1金属下塗層がニッケルと、クロムまたは窒化クロムとを有し、第2金属下塗層がニッケルと、クロムまたは 窒化クロムとを有することを特徴とする第1面ミラーまたは第2面ミラー。

【請求項2】 さらに、約1.65以下の屈折率をもつ 第1誘電層および約2.0以上の屈折率をもつ第2誘電 10 層の順序で構成された誘電層を有することを特徴とする 請求項1に記載の第1面ミラー。

【請求項3】 前記保護層が、約1.65以下の屈折率を有し、さらに、前記ミラーが、約2.0以上の屈折率をもつ誘電層を有することを特徴とする請求項1に記載の第1面ミラー。

【請求項4】 前記基板が、アルミニウムであり、さらに、前記ミラーが、前記基板と第1金属下塗層との間に配置されたチタンのボンディング層を有することを特徴とする請求項2または3に記載の第1面ミラー。

【請求項5】 前記第2金属下塗層が、ニッケルおよび 室化クロムを有し、かつ、約0.5ないし2nm(5ないし20A)の厚さを有することを特徴とする請求項ないし4のいずれか一項に記載の第1面ミラー。

【請求項6】 前記基板が、実質的に透明であり、さらに、前記ミラーが、前記基板と第1金属下塗層との間に配置された実質的に透明なパリヤ層を有することを特徴とする請求項1に記載の第2面ミラー。

【請求項7】 前記パリヤ層が、二酸化ケイ素を有する ことを特徴とする請求項6に記載の第2面ミラー。

【請求項8】 前記第1金属下塗層が、ニッケルおよび 窒化クロムを有し、かつ、約0.5ないし2nm(5ないし20A)の厚さを有することを特徴とする請求項6 または7に記載の第2面ミラー。

【請求項9】 前記保護層が、窒化ケイ素を有することを特徴とする請求項1ないし8のいずれか一項に記載のミラー。

【請求項10】 前記反射金属層が、90nm (900 A) 以上の厚さをもつ銀を有することを特徴とする請求項1ないし9のいずれか一項に記載のミラー。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は広くはミラーに関し、より詳しくは、化学的および機械的攻撃に耐え得る前面ミラーおよび後面ミラーに関する。

[0002]

【従来の技術】市販されている殆どのミラーは、光を反射するための銀の薄層がガラス基板の後面すなわち第2面上に蒸着された銀蒸着ガラス複合構造からなる第2面ミラー(second surface mirrors)である。銀蒸着ガラス 50

ミラーは、可視光反射率が高く、かつ、無色であること から広く要望されている。銀はガラスに直接付着し難い ので、銀を付着する前に、比較的薄い金属層がガラス面 に付着される。特に大気中のSO2 のような硫黄化合物 による損傷および品質低下から銀を保護するため、銀の 露出面には保護コーティングが付着される。一般的な保 護コーティングは銀の上に蒸着される銅層であり、該銅 層上には後で厚いペイント層が噴霧される。ペイント中 の鉛が硫黄または硫黄化合物と反応してPbSを形成す ると考えられる。銀層とペイント層との間に介在させら れる銅層は、銀に対するペイントの付着性を増大させ る。第2面が銀蒸着されたガラスミラー(第2面銀蒸着 形ガラスミラー)は、「ブラックエッジ」と呼ばれる現 象を受け易い。この品質低下作用は、ミラーの切断縁部 上の銀が水分に露出されるときに生じる。これにより化 学腐食が生じ、該化学腐食は、ミラー面の内方に向かっ て徐々に進行する「ブラックエッジ」を形成する。この 品質低下作用は、銀ミラーが硫黄化合物の汚染物質を含む 有する高湿度環境内で使用される場合には、一層増進され 20 れ、かつ、顕著に生じる。

【0003】また、上述した第2面銀ミラーの製造方法は、環境問題をも引き起こす。第1の問題は、製造工程において、廃棄物中に、鉛および他の化学物質が発生することである。たとえば、銀蒸着工程から生じる洗浄水は薬剤、銀、銅および錫を含有しており、環境保護局(EPA)により有害廃棄物として指定されている。【0004】

【発明が解決しようとする課題】ミラーのバッキング (裏塗り) に使用されるペイントは或る工業上の条件に 30 合致するけれども、ペイントも環境問題を生じる。たと えば、前述したように、銅の基層コーティングが最初に 銀に付着されるので、バッキングペイントは、銅との付 着性および銅との組合せにおける性能品質を有する必要 がある。製造業者は、ペイントが耐久性を有し、かつ、 銅およびその下の銀に良く付着することを強く要望して いる。これまで、これらの全ての要求を満たすペイント は鉛を含有している。現在使用されているペイントと置 換できる無鉛ペイントを開発する幾つかの試みがなされ ているけれども、鉛ペイントと同等に置換できる無鉛ペ イントは未だ開発されていない。有害な廃棄鉛の多く は、製造されたミラーの縁部を研削するとき、製造工程 の後段階で生じる。実際に、ミラーパッキングの一部は 良く研削される。この結果、研削水中には微量の鉛が検 出される。鉛ペイントの使用に付随する他の問題は、鉛 の存在を主な理由として、スクラップミラーの有効なり サイクリングが行えないことである。廃水処理手段およ びミラー製造設備からの流出液から生じる鉛、銀および 他の危険物質の浄化手段は、環境問題に対する安直な解

50 【0005】本発明の主たる目的は、化学的攻撃に耐え

3

得る耐久性のあるミラーを提供することにある。本発明の他の目的は、有害な廃棄物を生成することなく製造できるミラーを提供することにある。本発明のさらに他の目的は、従来の第2面ミラーに匹敵するかこれを超える可視領域反射率をもつミラーを提供することにある。 【0006】

【課題を解決するための手段】上記および他の目的は、 本発明により提供される耐久性のある第1および第2ミ ラーであって、その各々が、2つの金属下塗層の間に配 置された反射金属層を備えた第1および第2ミラーによ 10 り達成される。これらの下塗層は、ニッケルークロム合 金またはニッケルと窒化クロムとの混合物 (Ni-Cr N<sub>1</sub> )を備えている。これらの下塗層は薄く、したがっ て、これらの付着特性を犠牲にすることなく可視光の吸 収を最小限にする。本発明のある実施態様においては、 第1面ミラーがアルミニウム基板を有し、該アルミニウ ム基板上に、7つの層すなわち、チタン、ニッケルーク ロム合金、銀、N1-CrNx、窒化ケイ素、二酸化ケ イ素および二酸化チタンの層からなる薄膜が蒸着されて いる。第2面ミラーの実施態様においては、ミラーがガ 20 ラス基板を有し、該ガラス基板上に、5つの層すなわ ち、二酸化ケイ素、Ni-CrN: 、銀、Ni-CrN 1 および窒化ケイ素の層からなる薄膜が蒸着されてい

#### [0007]

【実施例】以下、添付図面に基づいて、本発明の実施例につき詳細な説明を加える。図1には、従来技術による一般的な第2面銀ミラー構造が示されている(第2面ミラーは、後面ミラーとも呼ばれている)。ミラーはガラス基板2を有し、該ガラス基板2の表面には銀層6がコ 30ーティングされている。ガラス基板2に対する銀層6の付着性を高めるため、銀を蒸着する前に、通常は錫からなる薄い金属層4がガラス基板2の表面上に蒸着される。周囲の環境からミラーを保護するため、ミラー上にはペイント層10がコーティングされる。ペイントは銀に付着し難いので、銀層6上には先ず薄い銅層8を蒸着し、その後該銅層8上にペイントをコーティングする。後面ミラーでは、光は基板2を通って入り、銀層6で反射され、基板2を通って出る。

#### 第1面ミラー

図2には、本発明を導入した新規な一体構造(モノリシック)の第1面ミラーが示されている(第1面ミラーは、前面ミラーとも呼ばれる)。ミラーは、基板20を一有し、該基板20は、空気に曝される後面である表面21と、コーティングされる表面22とを備えている。基板20はアルミニウムであるが、たとえば、ガラス、プラスチック、金属または木など、剛性支持体を構成する任意の適当な材料で形成することができる。

【0008】コーティングは7つの層で形成される。第 1層23は、アルミニウムへの銀の付着を助けるポンデ 50

ィング層である。基板20がアルミニウムではなく、銀 が良く付着する他の何らかの材料である場合には、ポン ディング層23は必ずしも必要でない。 ポンディング層 23はチタンを含む任意の適当な材料から構成される。 ポンディング層23の厚さは約20ないし1000人以 上、好ましくは約500ないし1000Aの範囲にでき る。ボンディング層23上には、約5~20A以上の範 囲の厚さをもつ第1下塗層24が設けられる。この第1 金属下塗層24は好ましくは約20ないし90%のニッ ケルと約10ないし40%のクロムとからなるニッケル -クロム合金であり、合金含有量は約80%のニッケル および20%のクロムであるのがより好ましい。合金 は、少量(約15%まで)の他の金属を含有できる。約 5ないし15%のモリプデンを含有する合金が、下塗層 24の化学的耐久性を一層増大させると考えられる。二 クロム (またはNiCr) とは種々の比率のニッケル、 クロムおよびモリプデンを含有する合金のことであり、 下塗層として他の金属を使用することもできる。或い は、下塗層24は、好ましくは約8ないし15A以上の 範囲の厚さをもつニッケル金属と窒化クロムとの混合物。 (NI-CrN: またはニッケル/クロム窒化物として: 示される)から構成される。Ni-CrNェ の下塗層 は、NiCrの下塗層より薄くしてもその付着機能を発っ 揮できることが判明している。

【0009】基板20が、アルミニウム、または、銀が 容易に付着しない他の金属であるときには、別体のポン ディング層を用いる代わりに、全体で約50ないし10 00人以上の厚みをもつ厚い第1下塗層24を使用できる。 る。これにより、ポンディング層23を不要にできる。 銀が、約5ないし20人の比較的薄い第1下塗層の補助。 により、ガラス、プラスチックおよび多くの金属を含む。 殆どの基板に付着するため、一般的にはボンディング層 が不要であることを強調しておく。次に、第1下塗層2 4上に反射金属層25が蒸着される。金属層25は可視 光を反射する。金属層25は多くの金属から形成できる けれども、特に満足できる金属は銀である。クロムは、 色が最少で高可視光反射率をもつ硬質耐食ミラーを製造・ できる点で満足できる。ニッケルークロム合金およびス テンレス鋼のような鉄-ニッケル-クロム合金は、同様 な高耐久性をもつけれども僅かに反射率が小さいミラー を作ることができる。アルミニウムおよびロジウムは、 クロムよりもかなり高い反射率をもつミラーを作るけれ ども、アルミニウム層は比較的柔らかく、かつ、耐食性 が小さく、ロジウムは非常に高価である。金属層25の 厚さは約500ないし1500人以上の範囲、より好ま しくは約700ないし800人の範囲内にある。金属層 25が銀を有する場合には、この厚さは約900ないし 1500 A以上、より好ましくは約1000ないし13 **00人にすべきである。** 

【0010】次いで、金属層25上に第2金属下塗層2

10

6が蒸着され、該層26上には保護層27が設けられ る。この第2金属下塗層26も、第1下塗層24に関し て説明したようにニッケルークロム合金で形成できるけ れども、Ni-CrN: で形成することがより好まし い。第2下塗層26はできる限り薄く維持すべきであ り、たとえミラーに影響を与えるとしても、ミラーの光 学的特性には悪影響を及ぼさないようにする。満足でき る下塗層の厚さは約5ないし20人の範囲内である。第 2下塗層26をNi-CrNrで形成する場合、その厚 → さは約8ないし15Aにすべきである。Ni-CrNz 層はNICェ層よりも薄くできるため、第2下塗層26 としてNi-CrNr を備えた第1面ミラーはNiCr からなる第2下塗層を備えた第1面ミラーより高い反射 率を有する。保護層27は、金属層25および第2下塗 層26を化学的攻撃、特に酸化から保護する。保護層2 7は、窒化ケイ素および窒化アルミニウム等の透明窒化 物で形成するのが好ましいけれども、窒化アルミニウム は水に溶けるため、窒化ケイ素の方が好ましい。保護層 27は約20ないし100人、より好ましくは約30な いし60人の厚さを有する。窒化ケイ素は、円筒状マグ 20 ネトロンを反応させてスパッタリングすることにより形 成される。使用される最も好ましい窒化ケイ素は、小さ な固有応力(intrinsic stress)を呈するものである。窒 化ケイ素の固有応力を低減させると、極めて硬く、か つ、化学的耐久性に優れた薄い薄膜が形成されることが 判明している。

【0011】コーティングの次の2つの層は、最初の低 屈折率誘電層28と、この上の高屈折率誘電層29とか らなる。本発明では、「低」屈折率とは1.65ないし 1. 48或いはこれより小さい範囲をいい、「高」屈折 30 率とは2. 0ないし2. 5或いはこれより大きな範囲を いう。550nmの波長での種々の材料の屈折率は、以 下にカッコで括って示す。好ましい実施例では、低屈折 率誘電材料としては二酸化ケイ素(1.48)が特に満 足でき、高屈折率誘電材料としては二酸化チタン(2. 5) が特に満足できるものであることが判明している。 使用可能な他の誘電材料として、酸化ニオブ、酸化タン タル、酸化錫、酸化亜鉛および酸化ジルコニウムがあ る。低屈折率誘電層28の厚さは約500ないし120 0 A、より好ましくは約615ないし920 Aの範囲で 40 ある。高屈折率誘電層29の厚さは約400ないし80 0Å、より好ましくは約415ないし625人の範囲で ある。低屈折率誘電層28および高屈折率誘電層29の 使用により、金属層25の反射率が増大する。たとえ ば、可視光の約98%を有する銀の積分反射率は、N1 - Cr Nr (またはNi Cr) の第2下塗層26により 約96%の反射率に低下させられる。しかしながら、低 屈折率誘電層28および高屈折率誘電層29を設けるこ とにより、反射率は約97%以上に増大される。反射率

加することにより増大できるけれども、増大領域の幅 (すなわちパンド幅) は減少する。また、誘電層の厚さ および/または誘電材料の選択を変えることにより、前 面着色ミラーを作ることができる。

【0012】別々の窒化ケイ素の層27および低屈折率 層28を設ける代わりに、約500ないし1200人、 より好ましくは約615ないし920Aの厚さをもつ単 一の窒化ケイ素の層27を設けることができ、これによ り、第1面ミラーは同等の高反射率を達成できるであろ う。本発明の第1面ミラーに低屈折率層28および高屈 折率層29を用いることは任意であることも強調してお く。しかしながら、両層28、29を使用しない場合にて は、周囲の環境からの第1面ミラーの保護は低下するで あろう。これを補償するため、保護層27の厚さを増大 させることができる。但し、保護層27の厚さの増大に つれてミラーの反射率は低下する。慣用的な第2面銀ミ ラーでは、光は厚いガラスを通って伝達され、銀層から 反射率され、その後、厚いガラスを通って戻される。こ れにより、物体がミラーのガラスに隣接して置かれる と、容易に認識できる二重像が形成される。本発明の前 面ミラーすなわち第1面ミラーでは、光が基板を通って 伝達されないこと、および、光が伝達される誘電層が慣 用的なミラーに見られるガラスに比べて極めて薄いこと から二重像の問題が解消される。慣用的なミラーでは、 ガラスが、周囲の環境から柔らかい銀層を保護する機能 を有する。本発明の前面ミラーでは、反射率を高める薄。 い誘電層が保護コーティングとしても機能する。

#### 第2面ミラー

本発明を導入した第2面ミラーが図4に示されている (第2面ミラーは、後面ミラーとも呼ばれる)。第2面 ミラーは基板40を有し、該基板40は、空気に曝され る後面である表面41と、コーティングされる表面42 とを備えている。基板40は、ソーダ石灰ガラスである が、結晶性水晶、溶融シリカ、および、ポリカーボネー。 ト並びにアクリレートのようなプラスチック等の実質的 に透明で剛性支持体を構成する任意の適当な材料でも形象 成できる。

【0013】コーティングは6つの層で形成されてい る。第1の層は実質的に透明なバリヤ層43であり、該 バリヤ層43は、第1金属下塗層および/または反射金 属層を攻撃する汚染物質に対するシールドとして作用す る。たとえば、ソーダ石灰ガラスは反射金属層を腐食す るナトリウムイオンを含有している。基板40が、

- (1) 金属層下塗層および/または反射金属層に悪影響 を及ぼす化学物質を含有していない材料、および、
- (2) 周囲の環境中の腐食性物質が金属下塗層および/ または反射金属層を攻撃することを充分防止できる耐久 性をもつ材料で作られている場合には、パリヤ層43は 不要である。パリヤ層43は、酸化ケイ素または酸化ア は、1つ以上の一連の高/低屈折率誘電層を、さらに付 50 ルミニウムで形成するのが好ましい。パリヤ層43の厚

7

さは約50ないし300Å、好ましくは約50ないし100Åの範囲にすることができる。パリヤ層43上には第1下塗層44が設けられる。該第1下塗層44は、ミラーの光学的特性に殆ど悪影響を与えないようにするため、できる限り薄く維持するのが好ましい。約5ないし20Åの範囲の厚さをもつ下塗層が満足できるものである。Ni-CrNiからなり、かつ、約8ないし15Åの厚さをもつ第1金属下塗層が好ましい。或いは、前述のように下塗層を二クロムで構成することもできる。Ni-CrNi下塗層は、NiCr下塗層より薄くでき、かつ、その付着機能を発揮できることが判明している。

[0014]次に、第1下塗層44上には反射金属層4 5 が蒸着される。該金属層45は可視光を反射する。金 属層45は多種類の材料で形成できるが、特に満足でき るものは銀である。第1面ミラーについて前述した理由 から、クロム、ニッケルークロム合金、ステンレス鋼の一 ような鉄ーニッケルークロム合金、アルミニウムおよび ロジウムを使用することができる。反射金属層45の厚 さは5.00ないし1300A以上、より好ましくは約8 00ないし1200人の範囲にできる。 金属層45を銀 で形成する場合には、厚さは約800ないし1400人 以上、より好ましくは約1000ないし1200人にす べきである。次いで、反射金属層4.5上に第2金属下塗 層46が蒸着され、該金属下塗層46上には保護層47 が設けられる。この第2金属下塗層46も、ニッケルー クロム合金またはNi-CrNr で形成できる。第2下 途層46は、約5ないし500A、より好ましくは約5 ないし2.0 Aの厚さを有し、第2下塗層46がNi-C r Nr であるときは、該層46の厚さは約8ないし15 A以上の範囲にすべきである。保護層47は、金属層4 5および第2下途層46を化学的攻撃、特に酸化から保 護する機能を有する。保護層47は、窒化ケイ素および 窒化アルミニウム等の窒化物で形成するのが好ましいけ れども、窒化アルミニウムは水に溶けるため、窒化ケイ 素の方が好ましい。保護層47は、約25ないし500 A以上、より好ましくは約50ないし75Aの厚さを有 する。窒化ケイ素は、円筒状マグネトロンを反応させて スパッタリングすることにより形成される。使用される 最も好ましい窒化ケイ素は、小さな固有応力を呈するも のである。窒化ケイ素の固有応力を低減させると、極め て硬く、かつ、化学的耐久性に優れた薄膜が形成される ことが判明している。

【0015】第2面ミラーに付加的保護を与えるため、保護層47上にプラスチック薄層(プラスチックラミネート)を設けることができ、この点についてはYoung 等に1990年10月23日に付与された米国特許第4,965,121号を参照されたい。なお、この米国特許は、本願に授用する。銀の反射金属層45に対しては層47上に蒸着される厚い亜鉛薄膜が良好な犠牲的を与えることが判明している。亜鉛が、硫黄または硫黄化合物の汚染物質と反応50

してZnSを形成することは明らかである。

#### 個々の層の蒸着

第1面ミラーおよび第2面ミラーの両方の場合に、NiCr(またはNi-CrNr)下塗層、パリヤ層、保護層および高/低屈折率誘電層はd.c.マグネトロンで蒸着される。誘電層は、円筒状の回転マグネトロンを用いたdc反応的スパッタリングスパッタリング(dc-reactive sputtering)により形成される。SiO2、SisN、およびTiO2等の誘電材料を用いた基板の蒸着に適した円筒状マグネトロンについては、Wolfe等に1991年9月10日に付与された米国特許第5,047,131号において説明されている。なお、この米国特許は本願に援用する。

【0016】窒素およびアルゴン等の不活性ガスを含む 大気中でのNi-CrNz 薄膜の反応的スパッタリング には、ターゲット材料が二クロムである円筒状または平 板状マグネトロンを使用できる。一般的なdcスパッタ リング温度では、ニッケルが窒化物を形成することはな い(窒素ガスが存在しなければ、窒素の代わりにニッケ ルおよびクロムからなる薄膜が蒸着される)。或いは、 Ni-CrNr 薄膜は、一方のカソードはニッケルをス パッタリングするニッケルターゲットを有し、他方の力 ソードは窒化クロムを反応的スパッタリングするクロム。 ターゲットを有するデュアルカソードを用いたマグネト ロンにより蒸着することもできる。回転可能な円筒状の デュアルマグネトロンを用いて窒化ケイ素を蒸着する場 合、窒化ケイ素の層の固有応力は、各カソードの磁石組 立体を鋭角に配向することにより低減できることが判明 している。図3は、真空チャンパ33内に配置されたデ ュアルカソード30A、30Bを備えたマグネトロンを 示す略断面図である。各磁石組立体32は、3つの長い 磁石34、36、38を備えた「W」形の形状を有す る。回転可能な円筒状マグネトロンでは、永久磁石がア ンパランス形装置を形成するのが一般的である。カソー ド30Aの磁石組立体32は約45°の鋭角 a: で配向 され、スパッタリングされた材料が蒸着チャンパ内に入 るときに基板31に向かうようにしている。同様に、カ ソード30Βの磁石組立体32も約45°の角度α2に 配向されている。各角度 $\alpha_1$  または $\alpha_2$  は独立的に約2 0ないし60°、より好ましくは約30ないし50°の 範囲、最も好ましくは約45°に定めることができる。 各カソードは基板31から約2.5インチ(約6.35 cm) の位置にあり、カソード30Aの中心はカソード 30Bの中心から約8.5インチ(約21.59cm) の位置にある。このようにして蒸着される窒化ケイ素の 固有応力は、磁石組立体が基板に対して直角に配置され ている場合に形成される窒化ケイ素の固有応力の約1/ 4である。Sis Na を反応させてスパッタリングする のにデュアルカソードを用いる必要はないが、単一カソ ードを用いる場合には、カソード30Aを用いて基板3

1をカソード30Aに向かって移動させるのが好ましい。

【0017】 銀金属層は平板状マグネトロンにより蒸着できるけれども、蒸発等の他の慣用的な方法も使用できる。チタンのボンディング層は平板状マグネトロンまたは他の慣用的な方法により蒸着できる。

#### 実験結果

図2および図4に示す構造をもつ第1面ミラーおよび第2面ミラーを、インラインマグネトロン装置で製造した。このマグネトロン装置は直列に配置された真空チャンバ内に収容されたマグネトロンを有し、各マグネトロンは層の1つを蒸着する。平板状マグネトロンを用いて、ボンディング層、下塗層および金属層を蒸着した。各々がモデルHRC-300ユニットを備えた平板状マグネトロンは、本願の譲受人の一部門であるAirco

Coating Technology社により製造されたものである。保護層および誘電層の蒸着には円筒状マグネトロンを使用した。各円筒状マグネトロンは、デュアルC-Nag(登録商標)モデル3000カソードで構成され、このカソードもAirco社により製造されている。各円筒状マグネトロンのターゲットは不活性ガスを用いてコンディショニングされ、その後、所望の分圧に到達するまでプロセスガスが添加された。このプロセスは、安定する時点まで作動した。次に、基板を第1円筒状マグネトロンのコーティング領域に導入し、薄膜を付着した。第1面ミラーにはアルミニウム基板を使用し、第2面ミラーにはソーダ石灰ガラス基板を使用した。

【0018】図2に示すように円筒状マグネトロンにおいて窒化ケイ素を反応させてスパッタリングする場合 30に、不活性ガスとしてアルゴンを使用し、反応ガスとして窒素を使用した。他の不活性ガスを使用することもできる(あらゆる種類の窒化ケイ素はSi。N.で表される)。ガスの分圧は、窒化物モードから金属モードへの圏移により決定した。実験は、実施可能な限りこの圏移の近くで行った。スパッタリングガスの圧力および流量は慣用的な装置で制御した。純粋ケイ素の導電率は非常に小さく、直流でのスパッタリングに適していないので、各ケイ素ターゲットには少量のアルミニウムを含浸またはドーピングした。各カソードの磁石組立体は、垂 40線から約45°の角度で配向した。スパッタリングガス

として窒素を使用し、コーティングはアルミニウムと窒化ケイ素との混合物を含有するものとなった。これらの全ての混合物は比較的硬質であり、強いパリヤとして作用するアモルファス薄膜を形成する。しかしながら、薄膜中のアルミニウムの量が所望のケイ素ペース化合物薄膜の形成を妨げることはない。形成された窒化ケイ素の化学量論(stoichiometry)は、Si₃ N4 の理論比3:4に近いことが判明している。

【0019】各Ni-CrNx 薄膜下塗層の蒸着には、 ニクロムターゲットを用いた平板状マグネトロンを使用 した。使用した二クロムは、約80%のニッケルおよび 20%のクロムから構成される。ガス混合物は約60% の窒素および40%のアルゴンから構成される。ニクロ ムターゲットからスパッタリングされたニッケルは窒化 物を形成せず、スパッタリングされたクロムが明らかに 窒化物を形成した。このようにして形成されたN1-C rNx 薄膜は、アモルファスで、化学的耐久性があり、 導電性を有し、極めて硬質で耐久性に優れたものであ る。本発明のミラーでは、Ni-CrNr を使用した場 合、下塗層(単一および複数)は、銀の付着性に影響を 与えることなく、NiCrより約40%薄くできる。さ らに、第1面ミラーの第2金属下塗層および第2面ミラ 一の第1下塗層の厚さを減少させると吸収が減少するた め、各ミラーの可視光の全体的反射は増大する。金属下 **塗層が過度に厚くなることを防止するため、マグネトロ** ン装置の真空チャンパ内にはシールドまたはパッフルを 用いて、スパッタリングされる幾分かの材料を遮断し、 かつ、基板上への蒸着速度を制御すべきである。下記の 表1および表2は、インラインマグネトロン装置を用い て、それぞれ本発明の第1面ミラーおよび第2面ミラー の蒸着を行った一般的なプロセスデータを示すものであ る。マグネトロン装置内のH2 Oの分圧は10-7トルに 等しいか、これ以下にすることを勧める。これは、水の 凝縮のためのマイスナーコイル(meisner-coils) または 髙真空ポンプの使用を含む慣用的手段により達成され る。他の予防策として、約1μの圧力まで装置に窒素ガ スを充填することにより、反応的スパッタリシグの前の 8ないし20時間、窒素中で装置を作動させる方法があ

[0020]

表 1

| 4.       |      |           |                | 第1面               | ミラー       |            |      |            |     |  |
|----------|------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|------|------------|-----|--|
|          | 厚さ   | 流量        | 流量             | 流量                | 流量        | 電位         | 電力   | 圧力         | パス数 |  |
|          |      | (SCCM)    | (SCCM)         | (SCCM)            | (SCCM)    |            |      |            |     |  |
| <u>層</u> | (A)  | <u>Ar</u> | N <sub>2</sub> | _0 <sub>2</sub> _ | <u>He</u> | <u>(V)</u> | (k₩) | <b>(μ)</b> |     |  |
| Ti ·     | 500  | 232       | 0              | 0                 | 0         | -537       | 20   | 2          | 1   |  |
| NiCr     | 20   | 232       | 0 .            | 0                 | 0         | -527       | 10   | 2          | 2   |  |
| Ag       | 1200 | 154       | 0              | 0                 | 0         | -531       | 10   | 2          | 1   |  |
| Ni-CrNx  | 8    | 95        | 143            | 0                 | 0         | -452       | 9.5  | 2.5        | 1.  |  |

| 11                  |     |    |     |     |     |      |     |     | 12 |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|
| S13 N4              | 50  | 41 | 270 | 0   | 12  | -451 | 6.5 | 2.5 | 1  |
| Si O <sub>2</sub>   | 562 | 22 | 0.  | 210 | . 0 | ~306 | 20  | 2   | 4  |
| Ti O <sub>2</sub>   | 543 | 10 | 0   | 102 | 0   | -402 | 17  | 2   | 16 |
| <b>庙田其坂・アルミーウ</b> 人 |     |    |     |     |     |      |     |     |    |

#### 表:2

#### 第2面ミラー

|                                |      |        | <u>жылы — у</u> |        |           |            |             |            |     |
|--------------------------------|------|--------|-----------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|-----|
|                                | 厚さ   | 流量     | 流量              | 流量     | 流量        | 電位         | 電力          | 圧力         | パス数 |
|                                |      | (SCCM) | (SCCM)          | (SCCM) | (SCCM)    |            |             |            |     |
| 層                              | (Å)  | Ar     | N <sub>2</sub>  | 02     | <u>He</u> | <u>(V)</u> | <u>(kW)</u> | <u>(µ)</u> | _   |
| Si O <sub>2</sub>              | 100  | 22     | 0               | 210    | 0         | -306       | 20          | 2          | 1   |
| Ni-CrNx                        | 8    | 95     | 143             | 0      | 0         | -452       | 9.5         | 2. 5       | 1   |
| Ag                             | 1200 | 154    | 0               | 0      | 0         | -531       | 10          | 2          | 1   |
| Ni-CrNx                        | . 20 | 95     | 143             | 0      | 0         | -452       | 9.9         | 2.5        | 2   |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | 50   | 41     | 270             | 0      | 12        | -451       | 6. 5        | 2.5        | 1   |
|                                |      |        | •               |        |           |            |             |            |     |

使用基板:ソーダ石灰ガラス (2.5 mm)

図5は、表1に記載した条件で製造した本発明の第1面 ミラーの、可視スペクトルについての放射波長に対する 百分率反射率を示すグラフである。反射率は、10°の 入射角度で測定した。

【0021】同様に、図6は、慣用的な第2面ミラーと 20 比較した、本発明の他の実施例による第1面ミラーについての放射波長に対する反射率を示すグラフである。本 発明の第1面ミラー(その反射率が曲線61で示されている)は次の構造を有している。

ガラス/NiCr/Ag/NiCr/Sis Na /Ti O2

(2. 5 mm/100 Å/900 Å/14 Å/391 Å/767 Å)

一方、慣用的な第1面ミラー(その反射率が曲線62で 示されている)は次の構造を有している。

ガラス/Al/SiO2/TiO2/SiO2/TiO

(2. 5 mm/7 0 0 Å/7 2 9 Å/4 7 3 Å/1 1 7 0 Å/7 4 0 Å)

明らかに、本発明の第1面ミラーのこの実施例は、表1に記載した実施例のように、保護層Si。N4と高屈折率層TiO2との間に別の層SiO2を有するものではない。また、基板がガラスであるので、ポンディング層は不要である。図7は表2に記載した条件で製造した本発明の第2面ミラーの、可視スペクトルについての放射波長に対する百分率反射率を示すグラフである。反射率は、10°の入射角度で測定した。

【0022】明らかに、本発明の第1面ミラーは約97 米の積分可視反射率を達成し、かつ、本発明の第2面ミ ラーは約88%の積分可視反射率を達成した。第2面ミ ラーについては、百分率反射率は、実質的に透明な基板 の厚さに基づいて定まる。たとえば6mmの厚さのガラ ス基板は、3mmの厚さのガラス基板に比べ反射率が約 2%低下する。以上、本発明を好ましい特定実施例に関 連して説明したが、上記説明および例は本発明の例示で 50 あって本発明の範囲を制限するものではない。本発明の 範囲は特許請求の範囲の記載により定められる。

#### [0023]

【発明の効果】本発明によれば、化学的攻撃に耐え得る耐久性のあるミラーを提供することが可能となる。また、本発明によれば、有害な廃棄物を生成することなく製造できるミラーを提供することが可能となる。さらに、本発明によれば、従来の第2面ミラーに匹敵するかこれを超える可視領域反射率をもつミラーを提供することが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術による第2面銀ミラーの略断面図である。

【図2】本発明にしたがって製造された第1面ミラーの 30 略断面図である。

【図3】マグネトロン装置の略断面図である。

【図4】本発明にしたがって製造された第2面ミラーの 略断面図である。

【図5】第1面ミラーについての波長に対する百分率反射率を示すグラフである。

【図6】第1面ミラーについての波長に対する百分率反射率を示すグラフである。

【図7】第2面ミラーについての波長に対する百分率反射率を示すグラフである。

#### 10 【符号の説明】

- 2 ガラス基板
- 4 薄い金属層
- 6 銀層
- 8 薄い銅層
- 10 ペイント層
- 20 基板
- 21 表面(空気に曝される後面)
- 22 表面(コーティングされる面)
- 23 第1層 (ポンティング層)
- 24 第1下塗層

(8)

特開平7-5309

13

25 反射金属層

26 第1金属下塗層

27 保護層

28 低屈折率誘電層

29 高屈折率誘電層

30A デュアルカソード

30B デュアルカソード

3 1 基板

32 磁石組立体

34, 36, 38 磁石

40 基板

41 表面 (空気に曝される後面)

42 表面 (コーティングされる面)

43 / パリヤ層

44 第1下強層(第1金属下塗層)

45 反射金属層

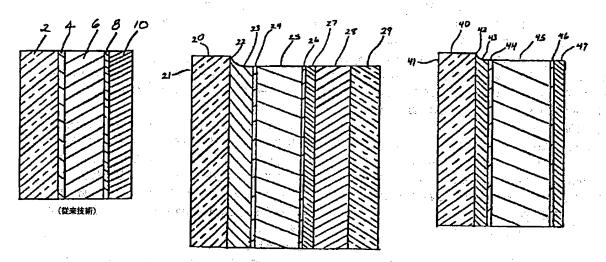
46 第2金属下塗層

47 保護層

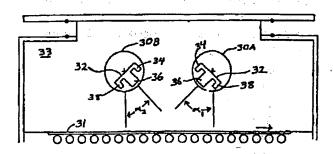
【図1】

[図2]

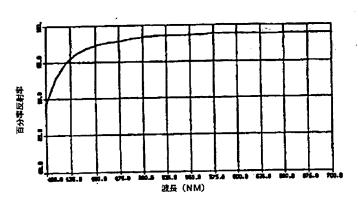
【図4】



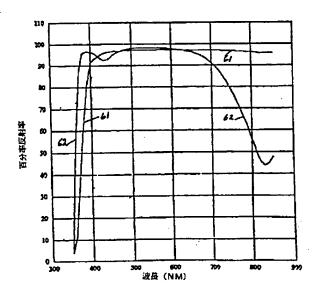
【図3】



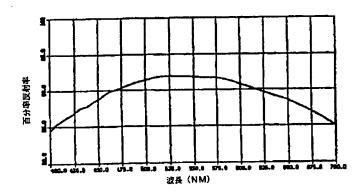




### [図6]



[図7]



### フロントページの続き

(72)発明者 ジョン エル ヴォッセン アメリカ合衆国 ニュージャージー州 08807プリッジウォーター サンセット リッジ 1012